

EPFULL

EPFULL (European Patents FULLtexts) ファイルは、1978 年以降発行された欧州特許 (出願および登録) の全文および PCT (特許協力条約) 経由で EPO に移行された特許の書誌情報を収録します。レコードには、書誌情報、明細書およびクレームの全文および法的状況が含まれます。1987 年以降の公開特許 (A) および 1991 年以降の登録特許 (B) は EPO の公用語である英語、ドイツ語あるいはフランス語のいずれかで全文情報を収録しています。標題は、英・独・仏の3言語で収録しています。公開特許のクレームはオリジナル言語でのみ収録し、登録特許のクレームは、英・独・仏の 3 言語で収録しています。公開特許の抄録は、オリジナル言語で収録しています。オリジナル言語が独・仏の公開特許については、数週間のタイムラグで英文抄録が追加されます。

当ファイルでは、特許、出願、優先権および関連特許情報、引用文献、抄録、明細書、クレーム、法的状況を検索することができます。同一の出願番号を持つすべての情報は一つのレコードにまとめられています。フルテキストおよび法的状況データは、European Patent Bulletins から収録しています。

EPFULL ファイルは STN Easy でも利用できます。

<https://stneasy-japan.cas.org/>

収録内容

すべての科学技術分野の特許 (全 IPC 範囲)

収録源

ヨーロッパ特許庁が発行した公開特許および登録特許

ファイル内容

1978 年から現在まで
レコード数は 3,101,000 件以上 (2011 年 7 月現在)
更新は毎週
アラート (自動 SDI 検索) は毎週実施

検索補助資料

オンラインヘルプ (HELP DIRECTORYで利用できるすべてのヘルプメッセージが表示されます。)
STNGUIDE

データベース製作者

European Patent Office
Vienna Sub Office
P. O. Box 90
Austria
Phone: (+43) 1/52126-0
Fax: (+43) 1/52126-5491
著作権所有者

データベース提供者

FIZ Karlsruhe
P. O. Box 2465
D-76012 Karlsruhe
Germany
STNmail: HLPDESK
Phone: (+49) 7247/808-555
Fax: (+49) 7247/808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
著作権所有者

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P. O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

一般社団法人 化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P. O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールド(/BIおよび/CLM)はアスタリスク(*)で示してあります。

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
基本索引* ¹⁾ 抄録 (/AB) クレーム (/CLM) 発明の詳細な説明 (DETD) 標題 (/TI) (以上からの切出し語)	なし または/BI	S PRINTED-CIRCUIT BOARD S STRIPPING DEVICE/BI S HOLOGRA?(S)?LASER?	AB, CLMEN, CLMD, CLMFR, DETDDE, DETDEN, DETDFR, TIEN, TIDE, TIFR
抄録	/AB	S PLATIN? CATALYST?/AB	ABDE, ABEN, ABFR
出願国 (WIPO コードおよび国名)	/AC	S EP/AC	AI
出願日 ²⁾	/AD	S AD=JAN 2003	AI
出願番号 ⁴⁾	/AP	S EP1996-300599/AP	AI
出願年 ²⁾	または /APPS /AY	S 1999-2000/AY	AI
代理人 ³⁾	/AG	S ROBERT WEYDERT/AG	AG
代理人, 国 (WIPO コードおよび代理人)	/AG. CNY	S AUSTRIA/AG. CNY	AG
代理人, 都市 ³⁾	/AG. CTY	S AACHEN/AG. CTY	AG
代理人, 通り ³⁾	/AG. STR	S SEELBERGSTRASSE/AG. STR	AG
代理人住所	/AGA	S MANNHEIM/AGA	AG
代理人番号	/AGN	S 00159811/AGN	AGN
レコード番号	/AN	S 2000:100003/AN	AN
クレーム * ¹⁾	/CLM	S OFFICE CHAIR/CLM	CLMEN, CLMDE, CLMFR
クレームの数 ²⁾	/CLMN	S 1/CLMN	CLMN
主クレーム	/MCLM	S KUNSTSTOFFABFALL?/MCLM	MCLM
発明の詳細な説明の数 ²⁾	/DETN	S DETN<3	DETN
指定国 (WIPO コードおよび指定国名)	/DS	S BE/DS	DS
資料種類 (コードおよび資料名)	/DT	S P/DT	DT
データ更新日 ²⁾	/DUPD	S DUPD=FEB 2003	DUPD
データ更新週 ²⁾	/DUPW	S 200409/DUPW	DUPW
入力日 ²⁾	または /UW /ED	S ED>AUG 2004	ED
入力日および法的状況の更新日	/EDLS	S 2005 JANUARY/EDLS	LSEP
特許入力日 ²⁾	/EDP	S EDP = DEC 2004	表示されない
フィールドの存在	/FA	S ABDE/FA	FA
国際特許分類 (主分類および副分類) ⁵⁾	/IC	S H05K007-14/IC	IC
国際特許分類, 版 ²⁾	/IC. VER	S 7/IC. VER	IC. VER
国際特許分類, 追加分類 ⁵⁾	/ICA	S F16H061-14/ICA	IC
国際特許分類, インデキシング コード ⁵⁾ (相補情報記号)	/ICI	S B29K105-08/ICI S A61K031:40/ICI	ICI, IC
国際特許分類, 主分類 ⁵⁾	/ICM	S C09K007-02/ICM	ICM, IC
国際特許分類, 副分類 ⁵⁾	/ICS	S D21C011-04/ICS	ICS, IC
旧 IPC (過去の ICM, ICS, ICA, ICI)	/ICO	S A01B043-00/ICO	LSEP.M
国際特許分類, 全 IPC (IPC 1-8)	/IPC	S A61K0031/IPC	
国際特許分類, 発効日 ¹⁾	/IPC. ACD	S 23 AUG 2003/IPC. ACD	
国際特許分類, 発行時の分類	/IPCI	S A61K0031-505/IPCI	
国際特許分類, キーワード	/IPC. KW	S INITIAL/IPC. KW	
国際特許分類, 再分類	/IPCR	S A61K/IPCR	
国際特許分類, 版 ²⁾	/IPC. VER	S 7/IPC. VER	
IPC メイングループ (範囲検索可能) ²⁾	/MGR	S B29K/ICI (T) 20-30/MGR	ICM, ICS
IPC サブグループ (範囲検索可能) ²⁾	/SGR	S H05K007/ICM(T) 10000-20000/SGR	ICM, ICS

1) このフィールドは, 前方一致検索に加えて中間一致・後方一致検索が可能です。中間一致・後方一致検索の(続く)際の語幹は少なくとも4文字以上の長さが必要です。

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) このフィールドでは, (S) 演算子をスペースで代用することができます。

4) STN 形式あるいはダウエント形式のどちらでも利用できます。

5) このフィールドには, 改定前 IPC (7 版までの IPC) が収録されています。このフィールドは改定後の IPC (8 版の IPC) で更新はされません。レコード中の全 IPC を検索するには/IPCフィールドを使用してください。

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
発明者	/IN	S MAYER ADOLF/IN	IN
発明者住所, 国名 (WIPOコードおよび国名)	または/AU /IN. CNY	S DE/IN. CNY	IN
発明者のコメント	/IN. COM	S THE OTHER INVENTORS HAVE AGREED TO WAIVE THEIR ENTITLEMENT TO DESIGNATION/IN. COM	IN
発明者の住所, 都市 ³⁾	/IN. CTY	S WIEN/IN. CTY	IN
発明者の住所, 通 ³⁾	/IN. STR	S BERLINER?/IN. STR	IN
発明者の住所 ³⁾	/INA	S MUENCHEN MURNAUER/INA	IN
発明者の住所, 変更前 ³⁾	/INAO	S KRANZ/INAO	LSEP. M
言語 (ISOコードおよび言語名)	/LA	S ENGLISH/LA	LA
言語 (出願) (ISOコードおよび言語名)	/LAF	S GREEK/LAF	LAF
言語 (手続き時)	/LAP	S FRENCH/LAP	LAP
法的状況コード (コードおよびテキスト)	/LSC	S EPB235/LSC	LSEP
法的状況テキスト	/LSTX	S REFUSAL OF APPLICATION/LSTX	LSEP
法的状況, 国 (WIPO コードおよび国名)	/LSCY	S BE/LSCY	LSEP
法的状況, 発効日 ²⁾	/LSDF	S LSDF=1978	LSEP
法的状況, 入力週 ²⁾	/EWLS	S 200451/EWLS	LSEP
法的状況, 発行日 ²⁾	/LSD	S 20050202/LSD	LSEP
法的状況, 発行年 ²⁾	/LSPY	S 2000/LSPY	LSEP
法的状況, 更新日 ²⁾	/UPLS	S 20050209/UPLS	UPLS
ライセンス取得者名 ³⁾	/LI	S CANDESCENT TECHNOLOGIES CORPORATION/LI	LI
ライセンス取得者所在, 国 (WIPO コードおよび国名)	/LI. CNY	S CA/LI. CNY	LI
ライセンス取得者所在, 都市 ³⁾	/LI. CTY	S LONDON W3/LI. CTY	LI
ライセンス取得者所在, 通 ³⁾	/LI. STR	S AM HARDTWALD/LI. STR	LI
ライセンス取得者所在 ³⁾	/LIA	S US/LIA S SAINT PIENCE/LIA	LI
ライセンス取得者所在, 変更前 ³⁾	/LIAO	S INTERMUNE CALIFORNIA	LSEP. M
ライセンス取得日 ²⁾	/LID	S 20010901-20010930/LID	LI
ライセンス, 指定国 (WIPO コードおよび国名)	/LIDS	S BE/LIDS S CYPRUS/LIDS	LI
ライセンス種類	/LIK	S E/LIK	LI
ライセンス取得者EPO番号	/LIN	S 7510/LIN	LI

(続く)

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) このフィールドでは, (S)演算子をスペースで代用することができます。

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
異議申立者名 ³⁾	/OP	S AMGEN/OP	OP
異議申立者所在, 国	/OP. CNY	S US/OP. CNY	OP
異議申立者所在, 都市 ³⁾	/OP. CTY	S THOUSAND OAKS/OP. CTY	OP
異議申立者所在, 通 ³⁾	/OP. STR	S DEHAVILLAND DRIVE/OP. STR	OP
異議申立代理人 ³⁾	/OPAG	S VOGELANG/OPAG	OP
異議申立代理人所在, 国	/OPAG. CNY	S DENMARK/OPAG. CNY	OP
異議申立代理人所在, 都市 ³⁾	/OPAG. CTY	S ABINGDON/OPAG. CTY	OP
異議申立代理人所在, 通 ³⁾	/OPAG. STR	S BERLINER ALLEE/OPAG. STR	OP
異議申立代理人所在 ³⁾	/OPAGA	S MUENCHEN/OPAGA	OP
異議申立代理人番号	/OPAGN	S 72473/OPAGN	OP
異議申立代理人, 変更前 ³⁾	/OPAGAO	S (ABB SCHWEIZ)/OPAGAO	LSEP. M
異議申立者 (完全情報) ³⁾	/OPA	S AMGEN THOUSAND OAKS/OPA	OP
異議申立者, 変更前 ³⁾	/OPAO	S AVECIA MANCHESTER/OPAO	LSEP. M
異議申立日 ²⁾	/OPD	S 19970101-19981231/OPD	OP
異議申立, 拒絶日 ²⁾	/OP. RD	S 2003 AUGUST/OP. RD	OP
異議申立, 終了日 ²⁾	/OP. TD	S 20041017/OP. TD	OP
異議申立種類	/OPK	S OPPOSITION WITHDRAWN/OPK	OP
異議申立番号	/OPN	S 80/OPN	OP
特許出願人 ³⁾	/PA または/CS	S BASF LACKE/PA	PA
特許出願人, 国名 (WIPOコードおよび国名)	/PA. CNY	S NL/PA. CNY	PA
特許出願人, 都市 ³⁾	/PA. CTY	S MANCHESTER/PA. CTY	PA
特許出願人, 指定国 (WIPOコード)	/PA. DS	S GB/PA. DS	PA
特許出願人, 通り ³⁾	/PA. STR	S VICTORIA STREET/PA. STR	PA
特許出願人住所	/PAA	S IRELAND/PAA	PA
特許出願人番号	/PAN	S 631710/PAN	PN
特許発行国 (WIPOコードおよび国名)	/PC	S WO/PC	PI
特許情報, 発行タイプ	/PIT	S EPB1 GRANTED PATENT/PIT	PIT
特許種別	/PK	S EPB1/PK	PI
特許番号 ⁴⁾	/PN	S EP140038/PN	PI
特許発行日 ²⁾	/PD	S EP-----140038/PN S PD=5 FEB 2004	PI
特許発行年 ²⁾	/PY	S 1999-2000/PY	PI
優先権主張国 (WIPOおよび国名)	/PRC	S AUSTRALIA/PRC	PRAI
優先権主張国, 原報の記載	/PRCO	S BELGIUM/PRCO	PRAO
優先権主張日 ²⁾	/PRD	S MAY 2003-Jun 2003/PRD	PRAI
最先の優先権主張日 ²⁾	/PRDF	S 20030109/PRDF	PRAI
優先権出願番号 ⁴⁾	/PRN	S US1986-817951/PRN	PRAI
優先権出願番号, 変更前	/PRN. OLD	S US1986-817951/PRN. OLD	LSEP. M
優先権出願番号, 原報の記載	/PRNO	S UA2003-3065259/PRNO	PRAO
優先権主張年 ²⁾	/PRY	S PRY=2003	PRAI
最先の優先権主張年 ²⁾	/PRYF	S PRYF=2003	PRAI

(続く)

- 2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
3) このフィールドでは, (S)演算子をスペースで代用することができます。
4) STN 形式あるいはダウエント形式のどちらでも利用できます。

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
引用非特許文献	/REN	S ABSTRACTS/REN	REN
引用特許, 発行国	/RPC	S EP/RPC	REP
引用特許番号, オリジナル	/RPN	S US1001612/RPN	REP
関連する出願, 出願国	/RLC	S EP/RLC	RLI
関連する出願, 出願日 ²⁾	/RLD	S RLD>=JAN 2003	RLI
関連する出願, 出願番号 ⁴⁾	/RLN	S EP1978-100191/RLN	RLI
関連する出願, 特許発行国	/RLPC	S EP/RLPC	RLI
関連する出願, 特許番号 ⁴⁾	/RLPN	S EP1000116/RLPN	RLI
関連する出願タイプ	/RLT	S EARLIER APPLICATION/RLT	RLI
標題 (TIEN, TIDE, TIFRを含む)	/TI	S ABISOLIERGERAET/TI	TIEN, TIFR, TIDE
標題, 変更前	/TIO	S DISPOSITIF DE DENUDAGE/TI	TL
標題の言語	/TL	S EN/TL S ENGLISH/TL	TL
更新日 ²⁾	/UP	S UP=JAN 2005	UP
更新週 ²⁾	/UW	S 200301-200305/UW	表示されない

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

4) STN 形式あるいはダウエント形式のどちらでも利用できます。

スーパーサーチフィールド

目的の情報を含む可能性があるフィールドが複数ある場合は、それらを含むスーパーサーチコードを利用します。スーパーサーチコードを利用すると、クロスオーバー検索およびマルチファイル検索が容易になります。ただし、スーパーサーチコードのEXPANDはできませんので、個々のフィールドコードでEXPANDしてください。

フィールド	スーパーサーチ コード	検索される フィールド	SEARCH 例	DISPLAY コード
出願番号グループ ¹⁾	/APPS	/AP, /PRN	S US1986-817951/APPS	AI, PRAI
国際特許分類	/IPC	/ICM, /ICS, /ICA, /ICI	S A01B001/IPC	ICA, ICI
特許国	/PCS	/DS, /PC	S EP/PCS	PC, DS
特許番号 ¹⁾	/PATS	/PN	S EP140038/PATS	PI
短縮基本索引	/SBI	/AB, /MCLM, /TI	S ANATOMIE/SBI	AB, TI, MCLM

1) STN形式あるいはダウエント形式のどちらでも利用できます。

DISPLAYおよびPRINT形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D L1 1-5 TIEN IN”のようにスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

すべての検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。ハイライト機能をご利用にならない場合にはSET HIGHLIGHT OFFと入力してください。システムのデフォルトはONになっています。HIT, KWIC, OCC表示形式を使うためには、検索時にハイライト機能がONになっていることが必要です。

形式	英語名	内容	入力例
AB. M (AB)	Abstract for all Publication Levels in all Languages	抄録 (全公報レベル, 全言語)	D AB. M
ABDE. M (ABDE)	Abstract for all Publication Levels in German	抄録 (全公報レベル, ドイツ語)	D ABDE. M
ABEN. M (ABEN)	Abstract for all Publication Levels in English	抄録 (全公報レベル, 英語)	D ABEN. M
ABFR. M (ABFR)	Abstract for all Publication Levels in French	抄録 (全公報レベル, フランス語)	D ABFR. M
AG	Agent	代理人	D AG
AGN	Agent Number	代理人番号	D AGN
AI (AP) ¹⁾	Application Information	出願情報	D AI PRAI 5
AI. M	Application Information for all Publication Levels	出願情報 (全公報レベル)	D AI. M
AN	Accession Number	レコード番号	D AN
CLM	Claims	クレーム	D CLM
CLM. M	Claims for all Publication Levels in all Languages	クレーム (全公報レベル, 全言語)	D CLM. M
CLM(n)	Claim number n in all Languages	クレーム (n:番号) (全言語)	D CLM(1)
CLM. PK ²⁾	Claims for a Certain Publ. Level in all Languages	クレーム (特定の公報レベル, 全言語)	D CLM. A1
CLM. PK(n) ²⁾	Claim Number n for a Certain Publ. Level in all Languages	クレーム (n:番号) (特定の公報レベル, 全言語)	D CLM. B1(1)
CLMDE	Claims in German	クレーム (ドイツ語)	D CLMDE
CLMDE. M	All Claims for all Publication Levels in German	クレーム (全公報レベル, ドイツ語)	D CLMDE. M
CLMDE. PK ²⁾	Claims for a Certain Publ. Level in German	クレーム (特定の公報レベル, ドイツ語)	D CLMDE. A1
CLMDE. PK(n) ²⁾	Claim Number n for a Certain Publ. Level in German	クレーム (n:番号) (特定の公報レベル, ドイツ語)	D CLMDE. A1(1)
CLMDE(n)	Claim number n in German	クレーム (n:番号) (ドイツ語)	D CLMDE ¹⁾
CLMEN	Claims in English	クレーム (英語)	D CLMEN
CLMEN. M	All Claims for all Publication Levels in English	クレーム (全公報レベル, 英語)	D CLMEN. M
CLMEN. PK ²⁾	All Claims for a Certain Publication Level in English	クレーム (特定の公報レベル, 英語)	D CLMEN. B2
CLMEN. PK(n) ²⁾	Claim Number n for a Certain Publ. Level in English	クレーム (n:言語) (特定の公報レベル, 英語)	D CLMEN. B2(1)
CLMEN(n)	Claim number n in English	クレーム (n:番号) (英語)	

(続く)

1) 出願番号および特許番号はSTN形式あるいはダウエント形式のどちらでも表示できます。デフォルトはSTN形式です。ダウエント形式でSEARCH, DISPLAY, PRINT, SELECT等を行う際は、あらかじめSETP ATENT DERWENTと入力しておきます。

2) PKは特許種別 (Patent Kind Code) を表します。該当する種別コードを入力してください。

DISPLAYおよびPRINT形式

形式	英語名	内容	入力例
CLMFR CLMFR.M CLMFR.PK ²⁾ CLMFR.PK(n) ²⁾ CLMFR(n) CLMN CLMN.M	Claims in French All Claims for all Publication Levels in French All Claims for a Certain Publication Level in French Claim Number n for a Certain Publ. Level in French Claim n in French Number of Claims Number of Claims for all Publication Levels	クレーム (フランス語) クレーム (全公報レベル, フランス語) クレーム (特定の公報レベル, フランス語) クレーム (n:番号) (特定の公報レベル, フランス語) クレーム (n:番号) (フランス語) クレームの数 クレームの数 (全公報レベル)	D CLMFR D CLMFR.M D CLMFR.A1 D CLMFR.A1(1) D CLMFR(1) D CLMN.M
DETD DETDDE DETDDE(n) DETDEN DETDEN(n) DETDFR DETDFR(n) DETN	Detailed Description Detailed Description in German Detailed Description in German, Paragraph n Detailed Description in English Detailed Description in English, Paragraph n Detailed Description in French Detailed Description in French, Paragraph n Number of Detailed Descriptions	発明の詳細な説明 発明の詳細な説明 (ドイツ語) 発明の詳細な説明 (パラグラフn:番号) (ドイツ語) 発明の詳細な説明 (英語) 発明の詳細な説明 (パラグラフn:番号) (英語) 発明の詳細な説明 (フランス語) 発明の詳細な説明 (パラグラフn:番号) (フランス語) 発明の詳細な説明の数	D DETD D DETDDE D DETDDE(2) D DETDEN D DETDEN(2) D DETDFR D DETDFR(2) D DETN
DS	Designated States	指定国	D DS
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
DUPD DUPW (UW) ED	Data Update Date Data Update Week Entry Date	データ更新日 データ更新週 入力日	D DUPD D DUPW D ED 1-10 L3
FA (FA.M)	Field Availability	フィールドの存在	D FA 1-20
IC IC.VER ICI ICM ICS ICA IPC	IPC IPC Edition IPC, Index IPC, Main IPC, Secondary IPC, Additional International Patent Classification	IPC, 国際特許分類 IPC, 版 IPC, インデキシングコード (相補情報) IPC, 主分類 IPC, 副分類 IPC, 追加分類 IPC, 国際特許分類	D IC D IC.VER D ICI D ICM D ICS D ICA D IPC
IN (AU)	Inventor	発明者	D TI IN 5
LA LA.M LAF LAF.M LAP LAP.M	Language Language of Publication for all Publication Levels Language of Filing Language of Filing for all Publication Levels Language of Procedure Language of Procedure for all Publication Levels	言語 言語 (全公報レベル) 言語 (出願) 言語 (出願) (全公報レベル) 言語 (手続き時) 言語 (手続き時) (全公報レベル)	D LA D LA.M D LAF D LAF.M D LAP D LAP.M
LI LI.M	Licensee Name Licensee Name for all publication levels	ライセンス取得者名 ライセンス取得者名 (全公報レベル)	D LI D LI.M

(続く)

2) PKは特許種別 (Patent Kind Code) を表します。該当する種別コードを入力してください。

DISPLAYおよびPRINT形式

形式	英語名	内容	入力例
LS ³⁾	Legal Status (from the INPADOC database)	法的状況 (INPADOC のデータ)	D LS
LS2 ³⁾	Legal Status (from the INPADOC database), detailed version with display headers	法的状況 (INPADOC のデータ) (詳細表示)	D LS2
LSEP LSEP.M	EPFULL Legal Status EPFULL Legal Status with History	法的状況 (EPFULL のデータ) 法的状況, 書誌情報の履歴を含む (EPFULL のデータ)	D LSEP D LSEP.M
MCLM MCLM.M	Main Claim Main Claim for all Publication Levels in all avail. Lang.	主クレーム 主クレーム (全公報レベル, 全言語)	D MCLM D MCLM.M
MCLM.PK ^{2,3)}	Main Claim for a certain publication level in all lang.	主クレーム (特定の公報レベル, 全言語)	D MCLM.A1
MCLMDE MCLMDE.M	Main Claim in German Main Claim for all Publication Levels in German	主クレーム (ドイツ語) 主クレーム (全公報レベル, ドイツ語)	D MCLMDE D MCLMDE.M
MCLMDE.PK ^{2,3)}	Main Claim for a certain publication level in German.	主クレーム (特定の公報レベル, ドイツ語)	D MCLMDE.A1
MCLMEN MCLMEN.M	Main Claim in English Main Claim for all Publication Levels in English	主クレーム (英語) 主クレーム (全公報レベル, 英語)	D MCLMEN D MCLMEN.M
MCLMEN.PK ^{2,3)}	Main Claim for a certain publication level in English	主クレーム (特定の公報レベル, 英語)	D MCLMEN.A1
MCLMFR MCLMFR.M	Main Claim in French Main Claim for all Publication Levels in French	主クレーム (フランス語) 主クレーム (全公報レベル, フランス語)	D MCLMFR D MCLMFR.M
MCLMFR.PK ^{2,3)}	Main Claim for a certain publication level in French	主クレーム (特定の公報レベル, フランス語)	D MCLMFR.A1
OP OP.M	Opponent Name Opponent Name for all publication levels	異議申立人名 異議申立人名, すべての公報レベル	D OP D OP.M
PA PAN	Patent Assignee Patent Assignee Number	特許出願人 特許出願人番号	D PA D PAN
PI (PN) ¹⁾ PI.M (PN.M) ¹⁾	Patent Information Patent Information for all Publication Levels	特許情報 特許情報 (全公報レベル)	D PI D PI.M
PIT PIT.M	Patent Information Publication Type Patent Information Publication Type for all Publ. Levels	特許情報 (特許種別) 特許情報 (特許種別, 全公報レベル)	D PIT D PIT.M
PRAI (PRN) ¹⁾ PRAI.M ¹⁾	Priority Information, Original Priority Information for all Publication Levels	優先権情報, オリジナル 優先権情報 (全公報レベル)	D PRAI D PRAI.M
PRAO	Priority Number, Original Format	優先権出願番号, オリジナル形式	D PRAO

(続く)

- 1) 出願番号および特許番号はSTN 形式あるいはダウエント形式のどちらでも表示できます。デフォルトはSTN形式です。ダウエント形式でSEARCH, DISPLAY, PRINT, SELECT等を行う際は、あらかじめSETP ATENT DERWENTと入力しておきます。
- 2) PKは特許種別 (Patent Kind Code) を表します。該当する種別コードを入力してください。
- 3) カスタム表示形式でのみ表示可能です。

DISPLAYおよびPRINT形式

形 式	英 語 名	内 容	入 力 例
REN	Referenced Non-Patent Literature	引用非特許文献	D REN
REN.M	Referenced Non-Patent Literature for all publication levels	引用非特許文献 (全公報レベル)	D REN.M
REP	Referenced Patent	引用特許	D REP
REP.M	Referenced Patent Literature for all publication levels	引用特許 (全公報レベル)	D REP.M
RLI	Related Application Information	関連する出願情報	D RLI
RLI.M	Related Application Information for all publication levels	関連する出願情報 (全公報レベル)	D RLI.M
TI	Title (contains TIEN, TIFR, TIDE)	標題 (TIEN, TIFR, TIDEを含む)	D TI
TI.M	Titles for all Publication Levels	標題 (全公報レベル)	D TI.M
TIDE	Title in German	標題 (ドイツ語)	D TIDE
TIDE.M	Title in German for all Publication Levels	標題 (全公報レベル, ドイツ語)	D TIDE.M
TIEN	Title in English	標題 (英語)	D TIEN 1-3
TIEN.M	Title in English for all Publication Levels	標題 (全公報レベル, 英語)	D TIEN.M
TIFR	Title in French	標題 (フランス語)	D TIFR
TIFR.M	Title in French for all Publication Levels	標題 (全公報レベル, フランス語)	D TIFR.M
TL	Title Language	標題言語	D TL
TL.M	Title Language for all Publication Levels	標題言語 (全公報レベル)	D TL.M
UP	Update Date	更新日	D UP

(続く)

DISPLAYおよびPRINT形式

形式	内 容	入 力 例
ALL ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, OP, LI, AB, DETD, CLM (最新の公報レベル)	D ALL
ALL.M ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, OP, LI, AB, DETD, CLM (全公報レベル)	D ALL.M
ALL.PK ^{1,2)}	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, OP, LI, AB, DETD, CLM (特定の公報レベル)	D ALL.A1
IALL ¹⁾	フィールド名付きインデント型ALL形式	D IALL
IALL.M ¹⁾	フィールド名付きインデント型ALL.M形式	D IALL.M
IALL.PK ^{1,2)}	フィールド名付きインデント型ALL.PK形式	D IALL.B2
DALL ¹⁾	デリミタ型ALL形式	D DALL
DALL.M ¹⁾	デリミタ型ALL.M形式	D DALL.M
APPS ¹⁾	AI, PRAI	D APPS
BIB ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP (最新の公報レベル)	D BIB
BIB.M ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP (全公報レベル)	D BIB.M
BIB.PK ^{1,2)}	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP (特定の公報レベル)	D BIB.M
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型BIB形式	D IBIB
IBIB.M ¹⁾	フィールド名付きインデント型BIB.M形式	D IBIB.M
IBIB.PK ^{1,2)}	フィールド名付きインデント型BIB.PK形式	D IBIB.B2
BRIEF ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, FA, AB, MCLM (最新の公報レベル)	D BRIEF
BRIEF.M ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, FA, AB, MCLM (全公報レベル)	D BRIEF.M
BRIEF.PK ^{1,2)}	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, FA, AB, MCLM (特定の公報レベル)	D BRIEF.A1
IBRIEF ¹⁾	フィールド名付きインデント型BRIEF形式	D IBRIEF
IBRIEF.M ¹⁾	フィールド名付きインデント型BRIEF.M形式	D IBRIEF.M
IBRIEF.PK ^{1,2)}	フィールド名付きインデント型BRIEF.PK形式	D IBRIEF.B2
IC	ICM, ICS	D IC
IND (IPC)	IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI (最新の公報レベル)	D IND
IND.M (IPC.M)	IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI (全公報レベル)	D IND.M
MAX ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, RLI, PRAI, REN, REP, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI, OP, LI, AB, DETD, CLM, LSEP (全公報レベル)	D MAX
IMAX ¹⁾	フィールド名付きインデント型MAX形式	D IMAX
SCAN ⁴⁾	TI (回答番号無しのランダム表示)	D SCAN

(続く)

1) 出願番号および特許番号はSTN 形式あるいはダウエント形式のどちらでも表示できます。デフォルトはSTN形式です。ダウエント形式でSEARCH, DISPLAY, PRINT, SELECT等を行う際は、あらかじめSETP ATENT DERWENTと入力しておきます。

2) PKは特許種別 (Patent Kind Code) を表します。該当する種別コードを入力してください。

4) SCANはコマンドに続けて入力します。例 : D SCANまたはDISPLAY SCAN

DISPLAYおよびPRINT形式

形式	内 容	入 力 例
STD ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, REN, REP, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, PRAI, RLI, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI (最新の公報レベル)	D STD
STD.M ¹⁾	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, REN, REP, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, PRAI, RLI, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI (全公報レベル) (デフォルト)	D STD. M
STD.PK ^{1,2)}	AN, ED, UP, DUPD, DUPW, TI, IN, PA, PAN, AG, AGN, REN, REP, LAF, LA, LAP, TL, DT, PIT, PI, DS, AI, PRAI, RLI, IC.VER, ICM, ICS, ICA, ICI (特定の公報レベル)	D STD. A1
ISTD ¹⁾	フィールド名付きインデント型ISTD形式	D ISTD
ISTD.M ¹⁾	フィールド名付きインデント型STD.M形式	D ISTD. M
ISTD.PK ^{1,2)}	フィールド名付きインデント型STD.PK形式	D ISTD. A1
TRIAL (TRI, SAMPLE, FREE)	TI, FA, DETD, CLMN	D TRI
TX	DETD, CLM (最新の公報レベル)	D TX
TX.M	DETD, CLM (全公報レベル)	D TX. M
TX.PK	DETD, CLM (特定の公報レベル)	D TX. B2
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後20語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

- 1) 出願番号および特許番号はSTN 形式あるいはダウエント形式のどちらでも表示できます。デフォルトはSTN形式です。ダウエント形式でSEARCH, DISPLAY, PRINT, SELECT等を行う際は、あらかじめSETPATENT DERWENTと入力しておきます。
- 2) PKは特許種別 (Patent Kind Code) を表します。該当する種別コードを入力してください。

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

SELECTコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にE番号を付与します。

ANALYZEコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にL番号を付与します。

SORTコマンドは、検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます。

(該当項目はY, 該当しないものはNで表示されています。)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
抄録	AB	Y	N
抄録 (ドイツ語)	ABDE	Y ²⁾	N
抄録 (英語)	ABEN	Y ²⁾	N
抄録 (フランス語)	ABFR	Y ²⁾	N
出願国	AC	Y	Y
出願日	AD	Y	Y
出願年	AY	Y	Y
代理人 (最新の公報レベル)	AG	Y	Y
代理人 (国)	AG. CNY	Y	Y
代理人 (全公報レベル)	AG. M	Y	Y
出願情報 (最新の公報レベル)	AI (AP, APPS)	Y	Y
出願情報 (全公報レベル)	AI. M	Y	Y
レコード番号	AN	Y	Y
クレーム (最新の公報レベル)	CLM	Y	N
クレーム (全公報レベル, 全言語)	CLM. M	Y	N
クレーム (特定の公報レベル, 全言語)	CLM. PK ³⁾	Y	N
クレーム (n:番号)	CLM. PK (n) ³⁾	Y	N
(特定の公報レベル, 全言語)			
クレーム (ドイツ語)	CLMDE	Y	N
クレーム (n:番号) (ドイツ語)	CLMDE (n)	Y	N
クレーム (全公報レベル, ドイツ語)	CLMDE. M	Y	N
クレーム (特定の公報レベル, ドイツ語)	CLMDE. PK ³⁾	Y	N
クレーム (n:番号)	CLMDE. PK (n) ³⁾	Y	N
(特定の公報レベル, ドイツ語)			
クレーム (英語)	CLMEN	Y	N
クレーム (n:番号) (英語)	CLMEN (n)	Y	N
クレーム (全ての公報レベル, 英語)	CLMEN. M	Y	N
クレーム (特定の公報レベル, 英語)	CLMEN. PK ³⁾	Y	N
クレーム (n:番号)	CLMEN. PK (n) ³⁾	Y	N
(特定の公報レベル, ドイツ語)			
クレーム (フランス語)	CLMFR	Y	N
クレーム (n:番号) (フランス語)	CLMFR (n)	Y	N
クレーム (全公報レベル, フランス語)	CLMFR. M	Y	N
クレーム	CLMFR. PK ³⁾	Y	N
(特定の公報レベル, フランス語)			
クレーム (n:番号)	CLMFR. PK (n) ³⁾	Y	N
(特定の公報レベル, フランス語)			
クレームの数 (最新の公報レベル)	CLMN	Y	N
クレームの数 (全公報レベル)	CLMN. M	Y	N

(続く)

1) ヒットタームだけを抽出するには、HITを使用します。例：SEL HIT IN

2) 抽出したタームに/ABを付与します。

3) PKは特許種別 (Patent Kind Code) を示します。該当する特許種別を入力してください。

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
発明の詳細な説明 (最新の公報レベル)	DETD	Y	N
発明の詳細な説明 (全公報レベル)	DETD. M	Y	N
発明の詳細な説明 (特定の公報レベル)	DETD. PK	Y	N
発明の詳細な説明 (パラグラフn: 番号)	DETD. PK(n)	Y	N
発明の詳細な説明 (ドイツ語)	DETDDE	Y	N
発明の詳細な説明 (パラグラフn: 番号) (ドイツ語)	DETDDE(n)	Y	N
発明の詳細な説明 (英語)	DETDEN	Y	N
発明の詳細な説明 (パラグラフn: 番号) (英語)	DETDEN(n)	Y	N
発明の詳細な説明 (フランス語)	DETDFR	Y	N
発明の詳細な説明 (パラグラフn: 番号) (フランス語)	DETDFR(n)	Y	N
発明の詳細な説明の数 (最新の公報レベル)	DETN	Y	N
発明の詳細な説明の数 (全公報レベル)	DETN. M	Y	N
指定国	DS	Y	N
資料種類	DT (TC)	Y	Y
データ更新日	DUPD	Y	Y
データ更新週	DUPW (UW)	Y	Y
入力日	ED	Y	Y
入力週	EW	Y	N
フィールドの存在	FA	Y	N
IPC (ICM, ICS, ICA, ICI)	IPC	Y	N
IPC (主分類および副分類)	IC	Y	N
IPC (主分類)	ICM	Y	Y
IPC (副分類)	ICS	Y	Y
IPC, 版	IC. VER	Y	N
サブクラスグループ	SCG	Y ⁴⁾	N
サブクラスグループ (追加)	SCGA	Y ⁵⁾	N
サブクラスグループ (主)	SCGM	Y ⁶⁾	N
サブクラスグループ (副)	SCGS	Y ⁷⁾	N
サブクラス	SCL	Y ⁴⁾	N
サブクラス (追加)	SCLA	Y ⁵⁾	N
サブクラス (主)	SCLM	Y ⁶⁾	N
サブクラス (副)	SCLS	Y ⁷⁾	N
発明者 (最新の公報レベル)	IN (AU)	Y	Y
発明者, コメント	IN. COM	Y	N
発明者住所, 国	IN. CNY	Y	N
発明者 (全公報レベル)	IN. M	Y	Y
発明者住所	INA	Y	N
発明者住所, 完全	INDD	Y	N
言語 (最新の公報レベル)	LA	Y	Y
言語 (全公報レベル)	LA. M	Y	Y
言語 (出願) (最新の公報レベル)	LAF	Y	Y
言語 (出願) (全公報レベル)	LAF. M	Y	Y
言語 (手続き時) (全公報レベル)	LAP. M	Y	Y

(続く)

- 1) ヒットタームだけを抽出するには、HITを使用します。例：SEL HIT IN
- 4) 抽出したタームに/ICを付与します。
- 5) 抽出したタームに/ICAを付与します。
- 6) 抽出したタームに/ICMを付与します。
- 7) 抽出したタームに/ICSを付与します。

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
ライセンス取得者名	LI	Y	N
ライセンス取得者所在, 国	LI. CNY	Y	N
ライセンス取得者所在, 指定範囲	LI. DS	Y	N
ライセンス取得者名 (全公報レベル)	LI. M	Y	N
ライセンス取得日	LID	Y	N
ライセンス種別	LIK	Y	N
ライセンス取得者EPO番号	LIN	Y	N
法的状況 (INPADOC のデータ)	LS	Y	Y
法的状況 (INPADOC のデータ, 詳細表示)	LS2	Y	Y
法的状況 (EPFULL)	LSEP	Y	Y
法的状況, 書誌情報履歴を含む	LSEP. M	Y	Y
法的状況, 失効日	LS. WD	Y	Y
法的状況, コード	LSC	Y	Y
法的状況, 国	LSCY	Y	N
法的状況, 発効日	LSDF	Y	N
法的状況, 発行日	LSD	Y	Y
法的状況, 更新日	UPLS	Y	N
主クレーム (最新の公報レベル)	MCLM	Y	N
主クレーム (ドイツ語)	MCLMDE	Y	N
主クレーム (全公報レベル, ドイツ語)	MCLMDE. M	Y	N
主クレーム (英語)	MCLMEN	Y	N
主クレーム (全公報レベル, 英語)	MCLMEN. M	Y	N
主クレーム (フランス語)	MCLMFR	Y	N
主クレーム (全公報レベル, フランス語)	MCLMFR. M	Y	N
ヒットタームの出現頻度	OCC	N	Y
異議申立人名	OP	Y	N
異議申立人所在, 国	OP. CNY	Y	N
異議申立人所在, 都市	OP. CTY	Y	N
異議申立人名 (全公報レベル)	OP. M	Y	N
異議申立, 拒絶日	OP. RD	Y	N
異議申立人所在, 通	OP. STR	Y	N
異議申立, 終了日	OP. TD	Y	N
異議申立人住所	OPA	Y	N
異議申立代理人	OPAG	Y	N
異議申立代理人所在, 国	OPAG. CNY	Y	Y
異議申立代理人所在	OPAGA	Y	N
異議申立代理人番号	OPAGN	Y	N
異議申立日	OPD	Y	N
異議申立人名および所在	OPDD	Y	N
異議申立種類	OPK	Y	N
異議申立番号	OPN	Y	N
特許出願人 (最新の公報レベル)	PA (CS)	Y	Y
特許出願人 (指定国)	PA. DS	Y	N
特許出願人 (全公報レベル)	PA. M	Y	Y
特許出願人, 国	PA. CNY	Y	Y
特許出願人所在, 完全情報	PADD (PAA)	Y	N
特許出願人, 番号	PAN	Y	Y
特許番号グループ	PATS	Y	N
特許発行国	PC	Y	Y
特許発行日 (最新の公報レベル)	PD	Y	Y
特許発行日 (全公報レベル)	PD. M	Y	N
特許発行年 (最新の公報レベル)	PY	Y	Y
特許発行年 (全公報レベル)	PY. M	Y	N

(続く)

1) ヒットタームだけを抽出するには, HITを使用します. 例: SEL HIT IN

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
特許情報 (特許種別)	PIT	Y	Y
特許情報 (特許種別, 全公報レベル)	PIT. M	Y	Y
特許種別 (最新の公報レベル)	PK	Y	Y
特許種別 (全公報レベル)	PK. M	Y	Y
特許番号 (最新の公報レベル)	PN (PI)	Y	Y
特許番号 (全公報レベル)	PN. M (PI. M)	Y	N
優先権主張国 (最新の公報レベル)	PRC	Y	Y
優先権主張国, オリジナル形式	PRCO	Y	Y
優先権主張日	PRD	Y	Y
優先権出願番号 (最新の公報レベル)	PRN (PRAI)	Y	Y
優先権出願番号 (全公報レベル)	PRN. M (PRAI. M)	Y	N
優先権出願番号, オリジナル形式	PRNO	Y	Y
優先権主張年	PRY	Y	Y
最先の優先権主張年	PRYF	Y	Y
引用非特許文献 (最新の公報レベル)	REN	Y	N
引用非特許文献 (全公報レベル)	REN. M	Y	N
引用特許 (最新の公報レベル)	REP	Y	N
引用特許 (全公報レベル)	REP. M	Y	N
関連特許出願国	RLC	Y	N
関連出願番号 (最新の公報レベル)	RLN	Y	N
関連出願番号 (全公報レベル)	RLN. M	Y	N
関連出願種別	RLT	Y	N
関連文献情報	RLI	Y	Y
関連特許発行国	RLPC	Y	N
関連特許番号 (最新の公報レベル)	RLPN	Y	N
関連特許番号 (全公報レベル)	RLPN. M	Y	N
標題 (最新の公報レベル)	TI	Y ⁸⁾ (デフォルト)	Y
標題 (全公報レベル)	TI. M	Y	Y
標題 (ドイツ語)	TIDE	Y	Y
標題 (全公報レベル, ドイツ語)	TIDE. M	Y	N
標題 (英語)	TIEN	Y	Y
標題 (全公報レベル, 英語)	TIEN. M	Y	N
標題 (フランス語)	TIFR	Y	Y
標題 (全公報レベル, フランス語)	TIFR. M	Y	N
標題の言語 (最新の公報レベル)	TL	Y	Y
標題の言語 (全公報レベル)	TL. M	Y	Y

1) ヒットタームだけを抽出するには, HITを使用します. 例: SEL HIT IN

8) TIEN, TIDEおよびTIFRがSELECTまたはANALYZEされ, /TIが付与されます.

サンプルレコード

MAX 形式での表示 (STN形式)

AN 2004:47476 EPFULL EDP 20050112 ED 20050112 UP 20050922 Full-text
 DUPD 20050921 DUPW 200538

TIEN System with a ferro-electric liquid crystal for two-fold optical inspection of containers.

TIFR Systeme comprenant un cristal liquide ferro-electrique pour l'inspection optique double des conteneurs.

TIDE Geraet mit einem ferro-elektrischen Fluessigkristall zur zweifachen optischen Inspektion von Behaeltern.

IN Furnas, William J., 915 Walnut Street, Elmira New York 14901, US

PA Emhart Glass S.A., Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham, CH

PAN 2612481

AG Warren, Anthony Robert, et al, BARON & WARREN, 19 South End, Kensington, London W8 5BU, GB

AGN 37331

LAF English

LA English

LAP English

TL German; English; French

DT Patent

PIT EPA1 Application published with search report

PI EP 1494014 A1 20050105

DS DE FR GB IT

AI EP 2004-253478 A 20040610

PRAI US 2003-610417 A 20030630

IC. VER 7

ICM G01N021-90

IGS G01N021-21; G02F001-13; G02F001-141

ABEN

An inspection system is provided which carries out two inspections with a single camera (26). In one inspection, polarized light illuminates the side wall of a bottle, passes through a pair of electrode surfaces (18, 22) on either side of a ferroelectric crystal device (20) which do not change the polarity, and passes through a polarizer (24) to image on the camera. In a second inspection the polarized light is rotated 90- by the same structure so that only light rotated as a result of stress in the bottle passes through the polarizer and images on the camera as a defect.

(image, 0.1, abstract drawing)

DETDEN

[0001] The present invention relates to machines which have a camera based inspection system for inspecting containers such as bottles for defects.

[0002] Machines for inspecting glass bottles conduct a great variety of inspections. More and more of these inspections are conducted using camera technology, and each camera adds substantial cost to the system.

[0003] It is an object of the present invention to provide a system for inspecting glass containers which will enable a single camera to carry out two inspections.

[0004] According to the present invention, there is provided a machine for inspecting containers as defined in claim 1.

MAX 形式での表示 (STN形式) (続き)

[0005] The present invention will now be described with reference to the accompanying drawings which illustrate a presently preferred embodiment incorporating the principals of the invention, and in which:

Figure 1 is a schematic illustration of an inspection machine made in accordance with the teachings of the present invention; and

Figure 2 is a schematic diagram for a temperature correction circuit for the voltage applied in Figure 1.

[0006] Figure 1 shows a bottle 10 being conveyed through an inspection station of an inspection machine by a conveyor 12. At this inspection station, light from a source of light 14 passes through a first polarizer 16, and this polarized light passes through the bottle in a direction perpendicular to the axis of the bottle. The light then passes through a first electrode surface 18, a FLC 20 (ferroelectric liquid crystal device), a second electrode surface 22, and a second polarizer 24 which has the same polarity as the first polarizer 16, and images on the imaging surface of a camera 26.

[0007] The operation of the electrode surfaces is controlled by outputs from a PLC (programmable loop controller) 28 which activates either circuits A or B to apply a voltage V from a source 30 to either the first or second electrode surface. When A is activated, the camera imaging surface will be illuminated with bright polarized light (the electrode surfaces and the FLC define the same polarity as the first and second polarizers), so that the side wall of the bottle can be inspected. When B is activated, the camera image will be black (the electrode surfaces and the FLC define a 90-rotated polarity), and as a result light will be blocked except where stress in the bottle due to a defect will change the polarity of the light so that a portion of the light passes through the second polarizer and strikes the camera imaging surface indicating a defect.

[0008] Figure 2 illustrates a temperature correction circuit for adjusting the relative polarization of the system due to environmental temperature variations. Plants where this equipment will be used often have a range of environmental temperatures that can exceed 50-F. It has been found that the contrast ratio of the system (the ratio of light mode to dark mode) is a function of temperature. To correct the error that results from these variations, an amplifier 32 is used which receives a temperature input from a temperature sensor 34 and which will output a voltage that changes with temperature in a way that will maintain the contrast ratio as high as possible over the operating temperature range. This can be effected in software or hardware.

MAX 形式での表示 (STN形式) (続き)

CLMEN

1. A machine for inspecting a container comprising
 - a conveyor for supporting a container at an inspection location,
 - an inspection system for inspecting a container when at the inspection location including
 - a camera having an imaging surface on one side of the container location,
 - a light source on the other side of the container location to direct light towards said camera,
 - a first polarizer between said light source and the container location, and
 - a first electrode surface on the one side of the container location between the container location and said camera,
 - a ferroelectric liquid crystal device on the one side of the container location between the first electrode and said camera,
 - a second electrode surface on the one side of the container location between the ferroelectric liquid crystal device and said camera,
 - a second polarizer between said second electrode surface and said camera, and
 - controller means for alternately operating said first and second electrode surfaces.

2. A machine for inspecting a container according to claim 1, further comprising means for relative rotation of polarized light by said first and second electrodes and said ferroelectric liquid crystal device as a function of temperature.

LEGAL STATUS INCLUDING HISTORY

AN 2004:47476 EPFULL Full-text
 20050105 EPB430 Unexamined document without grant, (first publication)
 20050105
 20050105 EPB840 Designated contracting states
 AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC
 NL PL PT RO SE SI SK TR
 EP 1494014 A1 20050105
 20050105 EPB844EP Extension of the European patent to
 AL HR LT LV MK
 20050810 EPB241 Request for examination
 20050610
20050810
 20050921 EPB840N Payment of designation fees
 DE FR GB IT
20050922

BRIEF 形式での表示 (ダウエント形式)

AN 2004:65520 EPFULL EDP 20050223 ED 20050223 UP 20050810 Full-text
 DUPD 20050810 DUPW 200532
 TIEN System and method for intelligent routing of telephone calls.
 TIFR Systeme et procede d'acheminement intelligent des appels telephoniques.
 TIDE Vorrichtung und Verfahren zur intelligenten Leitweglenkung eines Anrufs.
 IN Dutronc, Frederic, 3, rue de la Mare Adam, 92370 Chaville, FR;
 Bonneau, Florent, 171, avenue de Verdun, 92190 Meudon, FR;
 Mouminoux, Pierre, 21, passage Dumas, 75011 Paris, FR
 PA FRANCE TELECOM, (TELECOM, FRANCE), 6, Place d'Alleray, 75015 Paris, FR
 PAN 1334140
 AG Jeune, Pascale, FRANCE TELECOM/T&I/PIV/PI 38-40, rue du General-Leclerc,
 92794 Issy Moulineaux Cedex 9, FR
 AGN 99292
 LAF French
 LA French
 LAP French
 TL German; English; French
 DT Patent
 PIT EPA1 Application published with search report
 PI EP-----1509031 A1 20050223
 DS AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO
 SE SI SK TR
 EXTENSION STATES: AL HR LT LV MK
 AI 2004EP-0019442 A 20040816
 PRAI 2003FR-0010084 A 20030821
 IC. VER 7
 ICM H04M-003-42

ABEN

Telephone call routing process for use in office, involves locating callable user and routing telephone call towards one telephonic terminal in which user is located, during call towards telephone number associated to user

The process involves assigning a personal telephone number to a callable user on a telephonic network. The assigned telephone number is associated to different telephone numbers assigned to different telephonic terminals possessed by the user. The callable user is located and a telephone call is routed to one of the terminals in which the callable user is located, during the telephone call towards the assigned number. Independent claims are also included for the following: (a) a system for management of intelligent routing of telephone calls (b) a computer program adapted to be implemented on a telephone call routing system.

ABFR

La presente invention concerne un procede d'acheminement intelligent des appels telephoniques. Elle concerne aussi un systeme pour mettre en oeuvre le procede de l'invention.

Le procede d'acheminement intelligent des appels telephoniques consiste dans une premiere etape de configuration a affecter un numero d'identification a un utilisateur appellable sur au moins un reseau telephonique, puis dans une seconde etape d'exploitation, a mettre en relation ce numero d'identification unique avec une liste de numeros d'appel telephonique, construite automatiquement et dynamiquement et correspondant aux differents terminaux telephoniques aupres desquels l'utilisateur appellable est localise.

(image, 0.1, abstract drawing)

BRIEF 形式での表示 (ダウエント形式) (続き)

MCLMFR

Procédé d'acheminement intelligent des appels téléphoniques caractérisé en ce qu'il consiste:

- dans une première étape de configuration (E1), affecter un numéro téléphonique personnel à un utilisateur appelable sur au moins un réseau téléphonique, ledit numéro téléphonique affecté étant associé à une pluralité de numéros téléphoniques affectés aux différents terminaux téléphoniques que possède l'utilisateur;
- dans une seconde étape d'exploitation (E2), lors d'un appel téléphonique à destination dudit numéro de téléphone personnel affecté à l'utilisateur, localiser l'utilisateur appelable, et acheminer l'appel téléphonique vers au moins un des terminaux téléphoniques auprès desquels l'utilisateur appelable a été localisé.